



サプライヤ(中小企業)からの 重要技術情報漏えいに焦点を当てた 「経済産業省:技術情報管理認証制度」 の狙いと概要

2025. 11. 14

橘 了道

PwCコンサルティング合同会社



1. 技術情報管理認証制度(TICS)の全体像
2. 近時の改定内容
3. 今後の展望

Agenda

1. 技術情報管理認証制度（TICS）の全体像

- 技術情報管理認証制度（TICS）は、企業が保有する重要な技術情報や営業秘密の漏えいを防止し、中小企業を含む産業全体の情報管理水準を底上げすることを目的としています。

Why

-背景-

- 技術・研究情報の海外流出は経済安全保障・産業競争力の観点で**重大なリスク**
- 経済産業省は、企業の自律的な情報管理体制の整備を支援する仕組みとして2018年にTICSを創設（**産業競争力強化法** 第49条に基づく）

What for

—目的—

- 技術情報の適正管理を通じて**企業の信頼性と産業全体の競争力を強化**
- 特に中小企業の情報管理能力を高め、**イノベーションを支える基盤づくり**を促進

How

-仕組み-

- 制度は「**自己チェック**」と「**第三者認証**」の二層構成
- 企業はチェックリストを用いて自主点検が可能であり、希望に応じて登録認証機関による審査・認証を受けることが可能
- 8分野（ルール作り・実践/人的・設備的・サイバー対策・漏えい防止・漏えい後対応・取引先管理）での評価

Impact

-期待効果-

- 企業の情報管理力の底上げによる**日本企業の経済安全保障上の耐性の向上**
- 技術・知財流出防止による**国際競争力の強化**
- 産業エコシステム全体の**信頼性向上**

2. 近時の改定内容

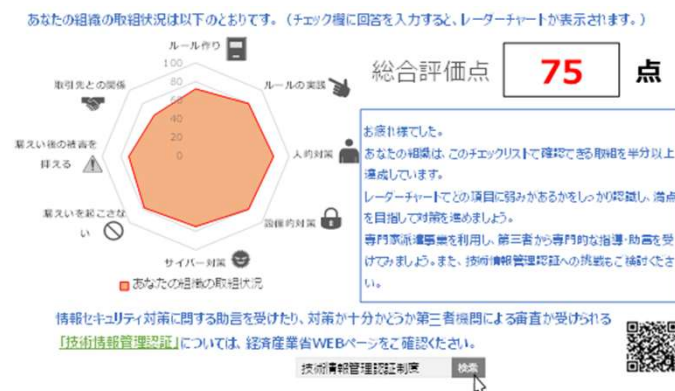
- 2024年・2025年にかけて、制度利用者の実務負荷軽減と運用実効性の向上を目的とし、基準および自己チェックリストが改定されています。

2024年8月：制度基準改定

- サプライチェーンセキュリティで先行している、日本自動車工業会／日本自動車部品工業会の評価水準と同期がとれるように改定
- ISO/IEC 27001の「検知・対応」領域などを照合し、管理体制の実効性強化
- 中小企業でも導入しやすい構造への簡素化（細かすぎた物理要件の整理や数値要件の削除など）

2025年5月：チェックリスト改訂

- 2024年の改定内容に合わせて自己チェックリストも改訂
- 20の質問項目から8分野の判定をし、レーダーチャートにて現況を評価



3. TICSの意義と活用可能性

- 制度創設から約5年が経過した現在、TICS認証の取得企業数は51社(掲載同意分)となっています。
しかしながら、日本の中小事業者は、企業数約175万社、個人事業者約162万人、合計約336万社(2021年総務省)です。うち、製造業の約33万5千社が主な対象ですが、現時点の認証事業者はその0.015%にすぎません。
→制度の認知・動機付け・運用支援の不足が課題。
- TICSは、国のセキュリティクリアランス制度が扱わない“民間の技術情報”に焦点を当てた制度であり、特に海外への情報流出対策という観点で独自の意義を持つ。
- 将来的には、セキュリティクリアランス制度や輸出管理スキームとの接続も視野に入る可能性はある。
- サプライチェーンセキュリティ対策評価制度との明確な棲み分けはまだ途上だが、TICSは“守るべき技術情報を可視化し、体制を整えるための自己診断ツール”として一定の価値があり、サプライチェーン評価制度の本格導入前の“足元固め”としての活用は有効と考えられる。

Thank you

ご清聴ありがとうございました

pwc.com

© 2025 PwC Japan LLC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.